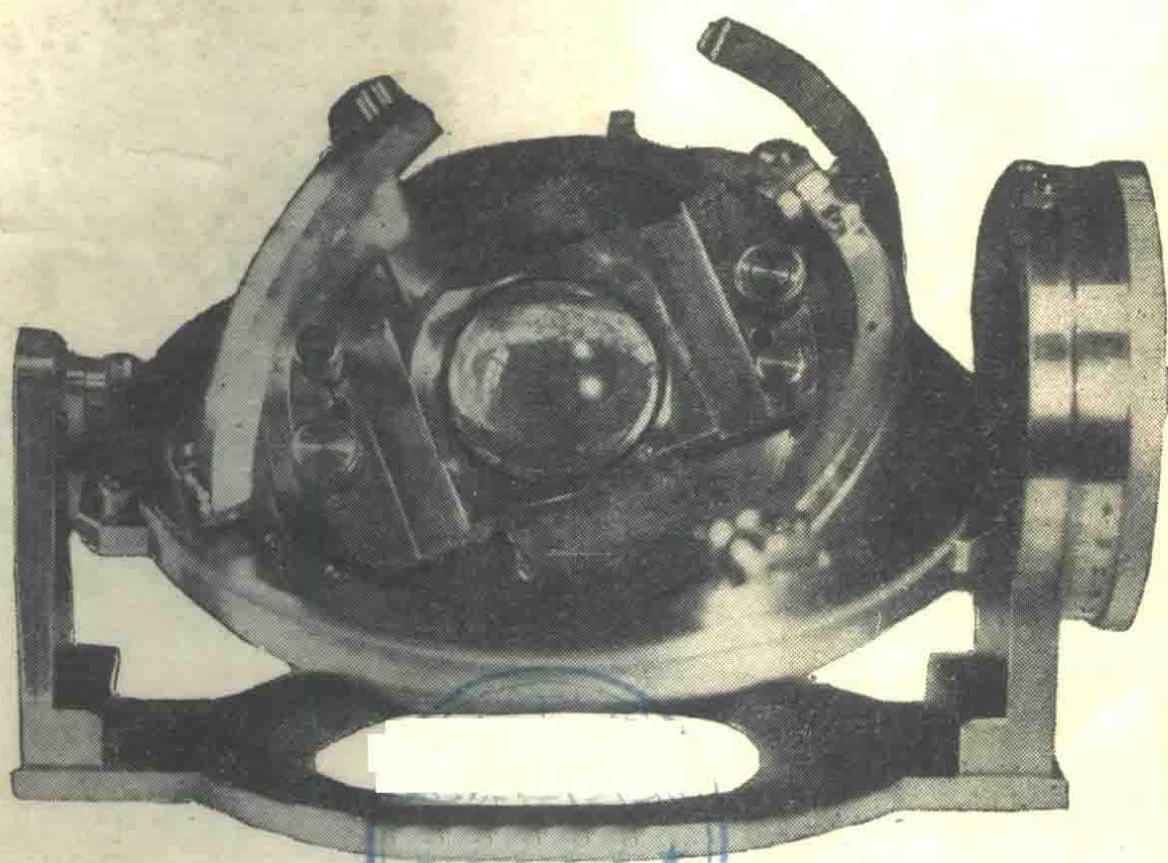


五軸費氏旋轉台 基本操作法

張保民 穆克敏 合著
王文遠 賀同興



地質出版社

五軸費氏旋轉台 基本操作法

張保民 穆克敏 合著
王文遠 賀同興

地质出版社

1956·北京

內容簡介

本書簡要地闡述了費氏旋轉台操作的基本原理和方法。在操作步驟上作了詳細的敘述。在應用上簡單介紹了斜長石鑑定的主要方法。對具有結晶光学基礎的讀者，可作為掌握費多洛夫法的自修材料，並可作為地質院校學生學習參考材料。

五軸費氏旋轉台基本操作法

著 者 張保民、穆克敏、王文遠、賀同興

出版者 地 質 出 版 社

北京宣武門外永光寺西街 3 号

北京市書刊出版發售許可證字第 050 号

發行者 新 華 書 店

印刷者 地 質 印 刷 厂

北京廣安門內教子胡同甲 32 号

編輯：朱迺升 技術編輯：李鑒如 校對：金伯瑤

印數(京)1—5,300 冊 1956 年 12 月 北京第 1 版

開本 31" × 43" 1/25 1956 年 12 月 第 1 次印刷

字數 50,000 字 印張 2 2/3 插頁 2

定價(10)0.36 元

目 錄

引 言	4
第一章 學習費氏旋轉台的結晶光学基礎	7
一、消光	7
二、干涉	8
第二章 五軸費氏旋轉台的構造和安裝	10
一、構造	10
二、旋轉台的安裝	13
三、旋轉台的檢查和校正	15
第三章 投影圖及其应用	18
一、赤平極射投影圖的構成及其特点	18
二、投影網	20
三、投影圖上投影点的轉動	23
四、投影圖的繪制与測量	25
第四章 晶体光性的測定	28
一、一軸晶礦物光軸方位的測定	29
I、一軸晶礦物切面种类的鑑別	29
II、一軸晶礦物光軸方位的測定	33
二、二軸晶礦物結晶要素与光性要素的測定	38
I、解理和結晶軸的測定	38
II、二軸晶礦物切面种类的鑑別	40
III、二軸晶礦物光学主軸的測定	44
IV、二軸晶礦物光軸角的測量及其折光率的校正	50
第五章 斜長石鑑定	58
一、瑞氏法鑑定斜長石	58
二、費氏法鑑定斜長石	58
附圖 (I) 吳氏投影網	
(II) 費氏投影網	
(III) 施氏等積投影網	
(IV) 斜長石双晶軸分布範圍圖	
(V) 斜長石双晶結合面極点分布圖	

引　　言

由于結晶學、礦物學和岩石學的發展，對於礦物光學性質的研究日益深入，對於光性常數的測定日益精確。普通偏光顯微鏡已不能滿足工作上的要求。而費氏旋轉台遂成為測定礦物光性的重要工具。

研究任一礦物的光學特性，特別是鑑定（如長石等復雜矽酸鹽）固溶體的系列礦物學，因其礦物化學成分的改變，光學性質亦隨之而變化。欲知其種類，就必須測定這些礦物的主要光學常數（如主要折光率、光軸角、消光角等）。

主要光學常數的測定，常須在定向切片中進行。定向切片有二種情形：一指結晶体的定向，如垂直於(010)晶面的切片或平行於(001)晶面的切片；一指光率體的定向，如垂直於光學主軸(X ，或 Y ，或 Z)或垂直於主要光學對稱面(XY ，或 XZ ，或 YZ)。定向切片在一般岩石薄片中極不易獲得。即使偶然得一定向的顆粒，由於顯微鏡載物台只能作水平轉動的限制，不可能使晶体切片作任意定向的轉動而進行測量，因此很難得到正確的結果以鑑別礦物的種類。

旋轉台的發明使礦物的研究方法起了決定性的變革。俄國地質學家費多洛夫（Е. С. Федоров）發明了旋轉台以後，便改變了顯微鏡載物台只能作水平轉動的限制，使任意礦物切片能在空間自由旋轉，而達到標準位置，（即相當於定向切片的位置），用以直接測量各種光學常數和光性方位。

為了紀念這位偉大學者的創造，人們把應用旋轉台研究礦物的方法稱作費多洛夫法。

費氏在1891年已經開始了有關長石的研究工作。1892年—1894年間，費氏創造了二軸旋轉台，這便是今日五軸旋轉台的雛型。這種旋轉台能使薄片在旋轉台上作空間轉動，且有計算旋轉度數的設備。但是，在薄片傾斜時，由於入射線對薄片底面成傾斜入射而發生折射，造成觀察和測量時的障礙或誤差。為了避免這種缺點，費氏設計了具有一定折光率的一對玻璃半球，將薄片以甘油粘合其間。構成了旋轉

台的重要組成部分。

这种頗似經緯仪的簡單旋轉台，已可用來鑑別均質体与非均質体，鑑別一軸晶与二軸晶。应用弗來納尔 (Biot-Fresnel) 定律決定二軸晶位置，求出 N_g 或 N_p 。并可根据干涉色的变化，确定双晶軸和光軸等。而这些性質，过去只能在錐形光下才能進行确定。

1898年，費氏制成了三軸旋轉台，即补充了 H 軸 (南北軸)。这样，便能直接求出晶体的光学对称面和光軸，对于方法的改進達到了一个完整的阶段。1903年，費氏有关論文十一篇公布于世，并对旋轉台的用法著書予以闡述。至此便完成了薄片中任一礦物光率体位置的鑑定工作。

以上費氏所称的三軸旋轉台实际上已具有四个轉軸，即 N 軸 (內立軸)， H 軸 (南北軸)， M 軸 (外立軸)， J 軸 (东西軸)。

在这时期，晶体的光性方向如光軸，光学主軸等都只能單独的个别測定。而光軸角、光性方位以及結晶要素的測定都須靠單独操作，將測量結果繪于投影圖 (赤平極射投影圖) 上。应用投影網求出軸、面間的相对位置。因此，投影圖便成为費多洛夫法中的重要組成部分。

二十世紀初，經典的費多洛夫法在俄國得到了完全的承認。并且出現了詳細介紹这一方法的教科書。

1929年，艾孟斯 (R. C. Emmons) 在改善旋轉台方面作了新的貢献。由于他增加了一水平轉軸后 (內东西軸) 使操作方法有了進一步的改善，使仪器的运用得到了很大的簡化。这便是今天的五軸費氏旋轉台。

我國学者何作霖教授对这种研究方法曾有了不少的貢献，在二十余年前，他已在著作中介紹了費氏旋轉台的用法，并首先把它应用到岩組学研究上去。二十余年來，有关論文散見中外雜志中。其中如四軸旋轉台代替五軸旋轉台之測定应用，河北房山周口店花崗閃長岩体的岩組研究部分，矽化木与瑪瑙之生長型以及國內若干地区斜長石的研究等，在科学上都有独到之處。

运用費氏旋轉台不僅是准确鑑定礦物的光学性質和研究系列礦物

的主要方法；同时也是研究岩石中礦物自然生長型式和空間排列體系、沉積狀態和變動狀態的方法之一。在礦物和岩石的研究工作中，費氏旋轉台的应用將日益廣泛。目前我國各地斜長石的系統研究，其他系列礦物如角閃石、輝石等的研究，岩組分析等工作，均尚待進行。

鑑于礦物學家、岩石學家和地質工作者必須熟練地掌握費多洛夫法，并把它运用到各种研究工作上的重要意义，我們寫此小冊子，便是为了把五軸費氏旋轉台的基本操作法介紹出來，供初学者作为參考。

第一章 學習費氏旋轉台的結晶光学基礎

一、消光

所有透明礦物，根據光学性質分為均質體與非均質體。非均質體中又分為一軸晶及二軸晶。高級晶系屬均質體，中級晶系屬一軸晶，低級晶系屬二軸晶。

晶体切片在直光鏡下，皆具有消光現象。凡均質體和非均質體之垂直光軸切片，呈永久消光。而非均質體之非垂直光軸各種切片，則呈四次消光現象。

具四次消光現象之切片，其光率體的截面必為橢圓。垂直切片入射光線的振動方向為橢圓的長徑和短徑方向，亦即此切片的消光位。當消光位平行十字絲即呈消光現象。

一軸晶平行光軸切片及斜交光軸切片，二軸晶垂直光学主軸切片及垂直主要光学對稱面切片，在直光鏡間呈四次消光。當達到消光時，一軸晶的光軸或二軸晶的光学主軸必在南北或東西直立面內。（參看圖1）因此，在費氏旋轉台上，常利用消光現象使此類定向切片達到標準位置而進行光軸或光学主軸方位的測定。

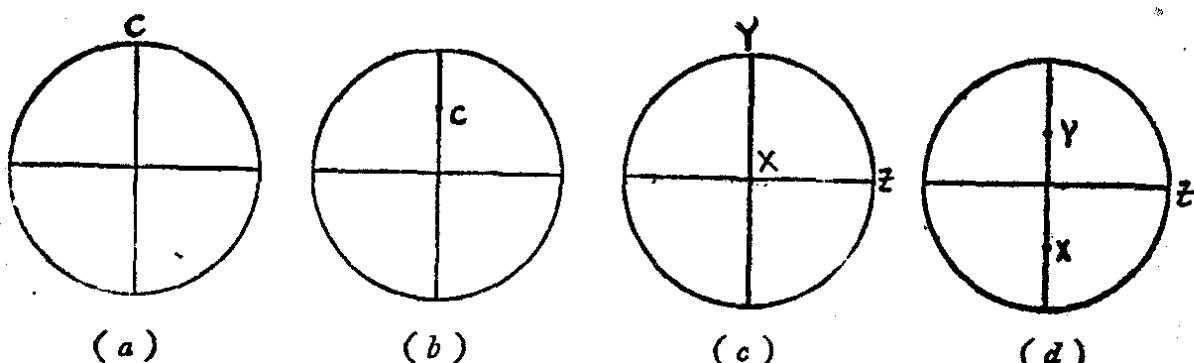


圖 1

二軸晶任意切片，在直光鏡間亦呈四次消光。但此種切片的消光位已與光学主軸無固定關係，其消光位服從于弗來納爾定律。即任意

切片的消光位，为入射光綫与二光軸（*A* 及 *B*）所成二面夾角的平分綫。参照圖 2 (b)，任意切片在光率体上所截椭圓的長徑和短徑即为其消光位，而光学主軸在面上的投影皆与之斜交。由此可知，如圖 2 (a) 所示，任意切片达到消光时，南北和东西直 立面內并无光学主軸。

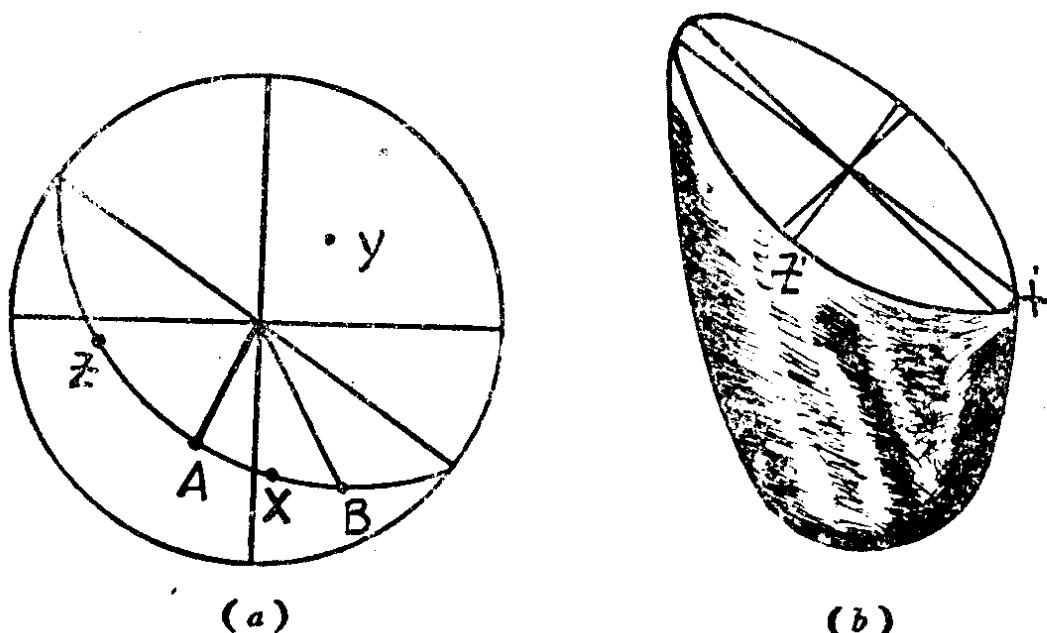


圖 2

一般岩石薄片中，大多数礦物切片与光学主軸无平行的关系，而在这种任意切片的情况下，不可能測定任何光性常数。凡遇此种切片，在旋轉台上如能利用各轉軸分別轉動，使其消光方向逐漸达到定向切片的消光位，即切片达到标准位置（如圖 1 (c)、(d) 等）时，始可作光性方位的測定。（其操作步驟見第四章）。

二、干涉

非均質体具四次消光現象的切片，在直光鏡間明亮时，即呈現干涉色。干涉色的級序决定于光程差 (*R*)。入射于晶体方向不同时，折光率不同，即双折射率($N_g' - N_p'$) 不同，亦即影响光程差的不同，故干涉色亦因方向而不同。在費氏旋轉台上，轉动任一水平軸使切片傾斜时，无異于改变入射方向，故干涉色必發生变化。

欲使任意切片达到标准位置，在五軸費氏旋轉台上則利用內立軸与內东西軸的联合轉动，使某一光学对称面逐漸直立。在操作过程中，須注意切片干涉色的变化——逐漸依次色序升高或依次色序降低。此时对于干涉色的辨别能力甚关重要，当光学对称面已接近直立时，往往因繼續轉动度数稍大而致超过直立位置，复向对側傾斜。仍顯示干涉色而并不消光。若繼續轉动，光学对称面傾斜愈大，干涉色序則向反方向变化，即原來逐漸降低，此时則逐漸升高；若原來逐漸升高，則此时逐漸降低。設对于干涉色的辨别能力甚強，則可避免此种錯誤。

例如圖3 (a) 为斜長石任意切片，干涉色为一級灰白色。当联合轉动內立軸与內东西軸时，达至(b) 圖情形，即 XZ 面已接近直立，呈暗灰色。若此时繼續轉动，可使达到直立。但若轉动过大，則又复向北傾斜，如(c) 圖情形，干涉色复升高至灰白色。

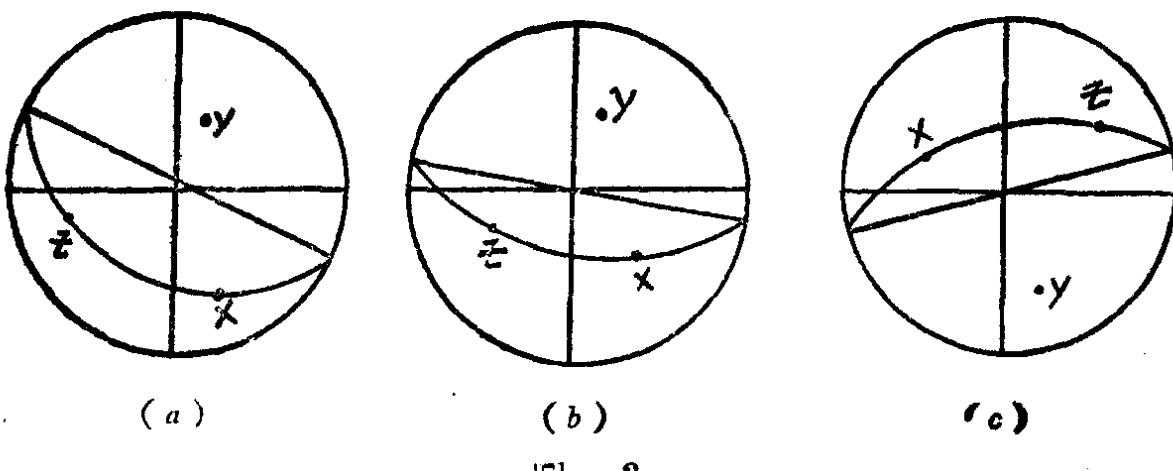


圖 3

第二章 五軸費氏旋轉台的構造和安裝

一、構造

旋轉台的主要構成部分為旋轉軸和玻璃半球。有不同直徑的金屬圓環，中央裝置玻璃半球，再加其他必要的附件便組成旋轉台。使用時固定于偏光顯微鏡載物台上。

I、旋轉軸

五軸費氏旋轉台，具有二直立轉軸、二東西軸及南北軸。每軸具有一固定金屬圓環，轉動時可自其外側圓環或金屬弧上讀出旋轉的角度。各軸的名稱及其代表符號如下表：

旋轉軸的名稱及符號

表 1

符 號 名 稱	費多洛夫 尼基丁	頓巴克 萊茵哈	烏路夫 茵 克	貝瑞克	萊茵哈	艾孟斯	本書用
內立軸	N	N	N	A ₁	N	I—S	A ₁
內東西軸	—	—	—	—	—	I.E—W	A ₂
南北軸	H	H	H	A ₂	H	N—S	A ₃
外立軸	M	M	M	A ₃	A	O—S	A ₄
外東西軸	J	J	J	A ₄	K	W—E	A ₅
顯微鏡軸	—	—	T	A ₅	M	M	M

內立軸(A₁)即最內圈之金屬環，作水平轉動。環上有一黑線，指向其外圈刻度環。黑線指0°時為原始位置。轉動內立軸時，由黑線所指度數可知其轉動的角度。記錄A₁=m°。

內立軸金屬環或稱內台。左右各具一螺絲孔，備固定玻璃半球之用。內台的內圈尚鑲有另一金屬環，系鑲嵌玻璃半球及薄片之用。同時具有升降薄片之裝置。德國制旋轉台的內台，有鎖緊器。用以管制內台之轉動。用時應加注意，用力稍大則極易損壞。

內立軸的轉動，僅攜帶薄片作水平旋轉，不影響其他旋轉軸。

內東西軸(A_2)即為艾孟斯增加的東西水平軸。轉動內東西軸時，既使內台外圈的刻度環作南北傾斜。內東西軸的右端，在其外側金屬環上有一旋緊螺絲，用以固定內東西軸的轉動。在同一金屬環之南北兩端，各具一刻度弧，(用時掀起)，內東西軸金屬環之南北兩端，各有一金屬柱，上有黑線，與刻度弧相對。從黑線所指刻度，得知內東西軸轉動的度數。記錄為 $A_2 = n^\circ$ 。當內東西軸向南傾斜時，用北端刻度弧。而向北傾斜時，則用南端刻度弧。內東西軸水平時，黑線對零度。

內東西軸轉動時，內立軸隨之傾斜。

南北軸(A_3)即為固定內東西軸之外側金屬環。南北二端固定於其外側另一金屬環上。轉動南北軸，使薄片東西傾斜。旋緊螺絲在南端。刻度弧在東西兩方。自東西二金屬柱的黑線指刻度，得出南北軸轉動角度。南北軸向東傾斜時，用西方刻度弧。而向西傾斜時，用東方刻度弧。水平時，黑線對零度。

南北軸轉動時，影響內立軸和東西軸。

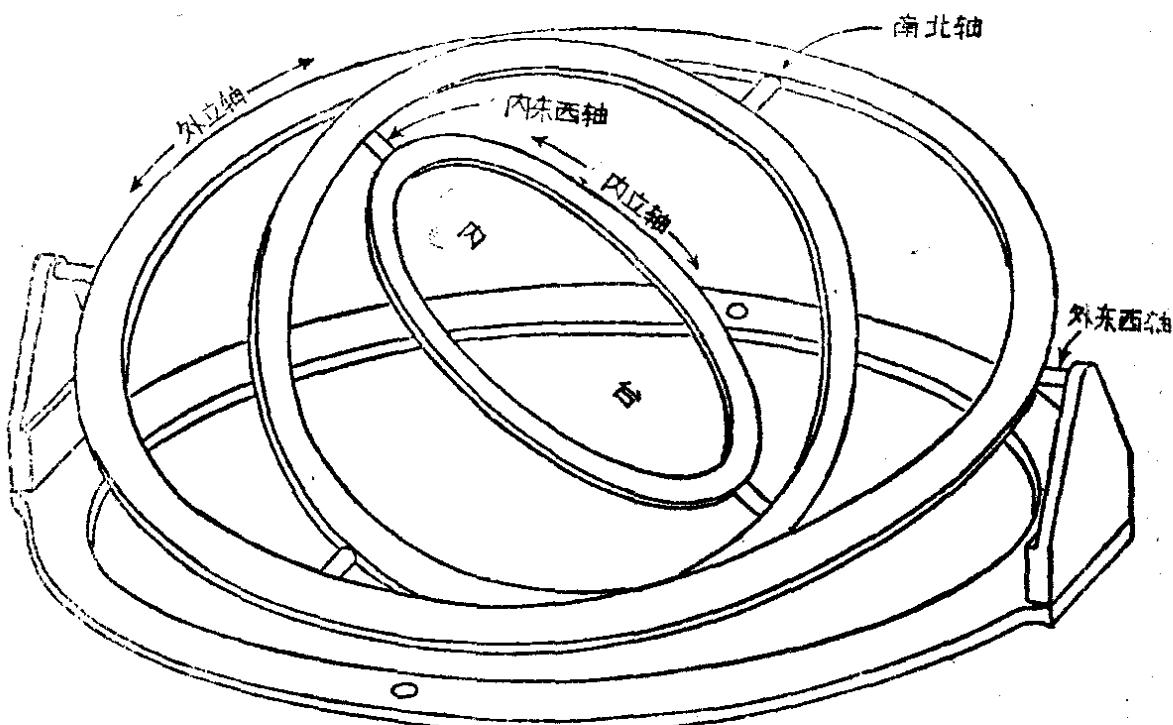


圖 4. 五軸費氏旋轉台圖解

外立軸(A_4)為最外圈刻度金屬環。可水平旋轉。環外左方有一標尺，指示外立軸旋轉角度。原始位置應使刻度環上零度對準標尺零位。外立軸之右側有一旋轉輪，輪之外側中心為固定外立軸的旋緊螺絲。

外立軸轉動時，能影響內立軸、內東西軸和南北軸。

外東西軸(I_5)即為前述的外側旋轉輪軸，作東西水平。轉動時，攜帶全部作南北傾斜。其轉動度數可由旋轉輪上讀出。旋轉輪上具有旋緊螺絲，固定其轉動。

由上可知，每一轉動軸的轉動，必影響居於其內的各軸的位置。而對其外側各軸，則毫無影響。

II、玻璃半球

用光学玻璃制成玻璃半球，具一定折光率。中間夾一岩石薄片，連合玻璃台的厚度，適成完整球形。礦物正居於球體中心。下半球鑲於圓形金屬環上。環之外圈具一缺口，用時可卡緊於內台之內環上。上半球則鑲於長方形金屬板中。板之左端有一圓孔，右端有一缺口，各與內立軸圓環上之螺絲孔相對。可用彈簧螺絲固定之。

鑲嵌上半球之金屬板上左右側各有一槽，加入固定薄片小尺，用以標記薄片之移動位置。

每一旋轉台，皆備有三對玻璃半球。各具一定折光率（德製有 $n=1.516$ ， $n=1.557$ ，及 $n=1.648$ 三對）。

應用玻璃半球的意義，即當薄片旋轉傾斜時使入射垂直球面入射，避免發生折射而造成誤差和觀察的障礙。若礦物折光率與玻璃半球折光率相等，則入射線完全不發生折射現象。在此情況下，所測得結果最正確。然因不同礦物其折光率不同，且同一礦物顆粒（非均質體）在不同方向，其折光率值亦有差異。欲使礦物折光率與半球折光率相等常不可能。因而入射線在經過玻璃半球與礦物薄片時，折射現象不能避免。為了減少誤差，應當尽可能選擇使用與礦物折光率相近的玻璃半球。例如二軸晶礦物，可使用與其 N_m 最相近的玻璃半球。

即使玻璃半球與礦物間折光率相近，但入射線仍然發生折射，如

圖 5 (a) 为礦物折光率小于玻璃半球折光率时的折射情况。(b) 为礦物折光率大于玻璃半球折光率时的情形。顯然 (a) 圖情形，实測角 θ 較真傾角 ϕ 小。而 (b) 圖情形，实測角 θ 較真傾角 ϕ 大。兩种情形都影响測量結果的正确度。故必加以校正。其校正方法見第四章。

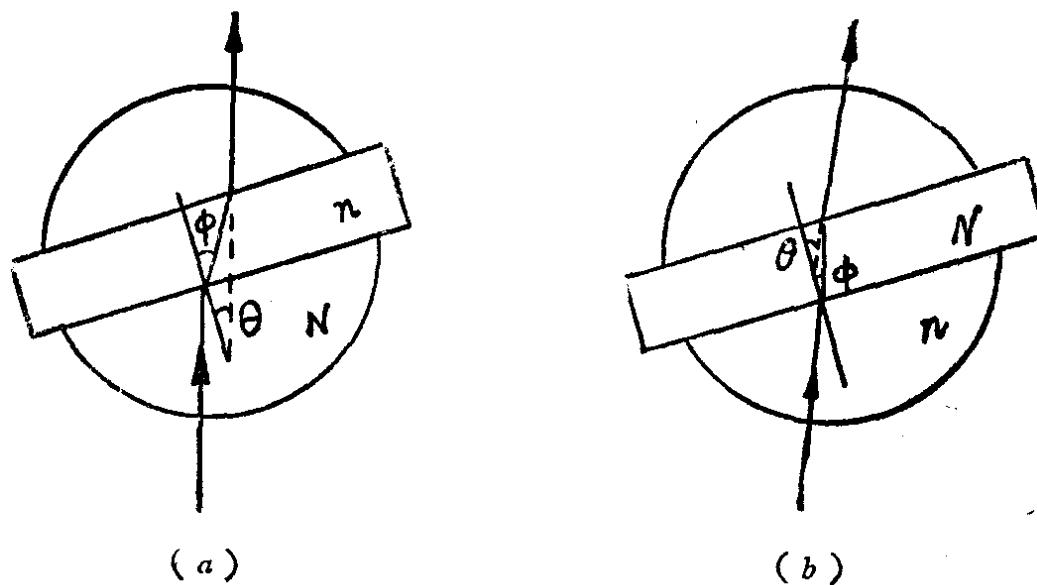


圖 5

旋轉台的主要構造已如上述。此外还附有專用的对物鏡和聚光鏡等。五个旋轉軸的金屬环互相牽制，而五个軸都必嚴格的交于玻璃半球的球心一点。直立軸（內立軸 A_1 ，外立軸 A_4 与顯微鏡軸 M ）都必完全重合一致。兩組水平軸（东西軸 A_2 、 A_5 与南北軸 A_3 ）必在同一絕對水平面內而且相互正交。所測礦物置于半球的中心。只有在此種条件下，轉動任一軸时，始能使礦物只作方位的轉变而不离开顯微鏡的中心。

二、旋轉台的安裝

使用旋轉台之前，除將顯微鏡、旋轉台及其必要附件准备外，在安裝、校正、操作和記錄作圖过程中，尚須事先准备 好下列備用品：

1. 对物鏡用前焦距較長的才不会接觸玻璃球。測定解理面、双晶結合面等时可用高倍接目鏡及对物鏡。作光性方位的測定时，可用低

倍对物鏡。接目鏡可用(8×)或(12×)

2. 光源：一般用太阳光，必要时用50—100瓦日光灯。
3. 薄片：岩石或矿物薄片，底玻璃厚度不大于1.2公厘。
4. 甘油或液体石蠟一瓶：用以粘合玻璃半球和薄片。
5. 滴管：尖端要处理圆滑，以防划刻旋转台上的玻璃板，用以滴入甘油。
6. 二甲苯：清洗旋转台上甘油或液体石蠟用。
7. 药棉或镜头纸：擦干用。
8. 烏氏投影網：半徑为10公分。若作岩組圖，尚須准备施氏(Schmidt)等積投影網及岩組繪圖器。
9. 繪圖透明紙：紙上作半徑10公分之大圓。圓心对准投影網中心，并在大圓外标志南北东西。

由于仪器的复雜精密，工作要求十分嚴格。故在安装旋转台时，手續亦甚繁复。茲將安装过程及其应注意事項簡述如下：

(一) 顯微鏡的准备：事先將顯微鏡各部加以檢查，选用合适的接目鏡和对物鏡。將对物鏡作好中心校正。上下偏光鏡正交。取下載物台中央空心鐵板及薄片夾子。提升鏡筒达相当高度，可能时下降載物台至适当低度。

(二) 安裝下半球：苏联制旋转台的下半球，直接放置在內立軸內环中，平面向上即可。而德制旋转台的下半球須進行以下安裝手續：取出旋转台后，放鬆南北軸或內东西軸之旋緊螺絲。选好适用的玻璃半球。將玻璃圓板置內环上放平。安装薄片和上半球在中央圓玻璃板上，滴甘油数滴，將薄片稍稍傾斜，先使薄片一边接触甘油，然后随甘油的浸潤，緩慢平置其上，再滴甘油于薄片上，將上半球粘合于薄片上面。也使玻璃球的一边先接触甘油，以防气泡混入。上半球金屬板長邊为东西方向，圓孔在右，缺口在左，各以彈簧螺絲固定于內环上。此时薄片可以移动而不致自由滑走。

(三) 返轉內立軸环180°，底面向上。以滴管向圓玻璃面上滴入甘油数滴。然后將下半球緩緩扣入內环，使半球平面緊密粘合于圓玻璈上，中間应防止有气泡存在，以免入射光線產生折射。

下半球扣緊后，迴轉內環，恢復原位。

(四) 固定旋轉台：將裝好薄片的旋轉台置顯微鏡載物台上。使旋轉台底盤的南北二圓孔對准載物台南北二螺絲孔，以螺絲固定之。但此時並不旋緊，以備檢查校正。

最後，旋轉載物台一周，旋轉台若有障礙不能通過，即升高載物台或降低載物台，使旋轉台自由通過為止。然後下降鏡筒，對光焦準。安裝手續即已完成。

三、旋轉台的檢查和校正

旋轉台固定在顯微鏡上，其各部機構，均須有固定的关系。任一條件發生差誤，直接影響工作結果。因而在安裝前後，必須對各部效能作精密的檢查和校正工作。

(一) 上下偏光振動面是否正交：在安裝旋轉台之前，將鏡筒直對光源，加入上偏光鏡，若不黑暗，即不正交，下偏光鏡使之南北平行，調整上偏光鏡使之全黑暗，則已正交。

(二) 接目鏡十字絲是否正交南北和東西，亦應檢查。

(三) 對物鏡在安裝旋轉台前必須作好中心校正。

(四) 對物鏡和玻璃半球是否具非均質性：各鏡頭玻璃，必須是完全均質體。在直光鏡間，安裝被檢查的鏡頭或玻璃半球，加入貝氏補色器，轉動被檢查鏡頭或半球，若有非均質性，其雙折射產生的光程差即使僅是 $1/4\mu\mu$ （或 $1\mu\mu$ ），亦可呈現類似二軸晶干涉象之黑帶開合的現象。具有此性質的鏡頭和玻璃半球，不能應用。

(五) 所有直立軸的重合校正：顯微鏡軸M和旋轉台直立軸 A_1 和 A_3 都必須嚴格的重合在同一直立線上。即旋轉台的中心點必須與接目鏡十字絲的交點重合。檢查時，先焦準薄片，旋轉台各軸鎖在零位。轉動旋轉台的 A_1 ，視薄片迴轉中心，即旋轉台中心是否與十字絲交點重合。若不重合，可移動旋轉台（因安裝時，旋轉台底盤螺絲並未旋緊），使二者重合。然後旋緊固定螺絲。

此步校正，往往須返復多次。直到二個中心完全重合，或者距

离不超过 50μ 始可。

(六) 内立軸与外立軸的檢查：經過上述(五)的檢查后，立即分別轉動內立軸和外立軸，視中心是否仍重合，二者中心距誤差亦不能大于 50μ ，否則旋轉台不好使用。

(七) 校正东西軸和南北軸：旋轉台东西軸 A_2 和 A_5 ，必平行東西綫；南北軸 A_3 必平行南北綫。檢查時，先焦准玻璃半球表面某一塵埃，各轉軸保持零位。轉動南北軸，視小塵埃是否東西移動。若南北軸不在南北方向，則塵埃移動綫不平行東西綫，如圖 6 (a)，同時旋轉東西軸，塵點移動亦不平行南北綫，如 (b)。轉動載物台，直至移動綫完全平行十字絲為止。即水平轉軸與十字絲互相平行，鎖緊載物台，並記標尺所指載物台刻度。

若為初次使用的旋轉台，則必檢查東西軸與南北軸是否正交，及二東西軸 A_2 與 A_5 是否重合一致。檢查時，首先轉外東西軸，使塵點沿南北綫移動。再轉內東西軸，若仍沿南北綫移動，則 A_2 與 A_5 一致。最後轉南北，若沿東西綫移動，即南北軸與東西軸正交。設發現 A_2 與 A_5 不一致時，轉動外東西軸尚可有些微校正，當 A_3 與 A_2 不正交時，旋轉台不好使用。

(八) 矿物位于水平軸平面內的校正：把薄片中礦物校正在與各水平轉軸位于同一平面內是很重要的工作。

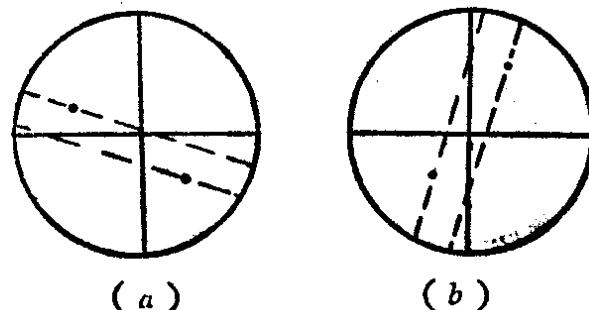


圖 6

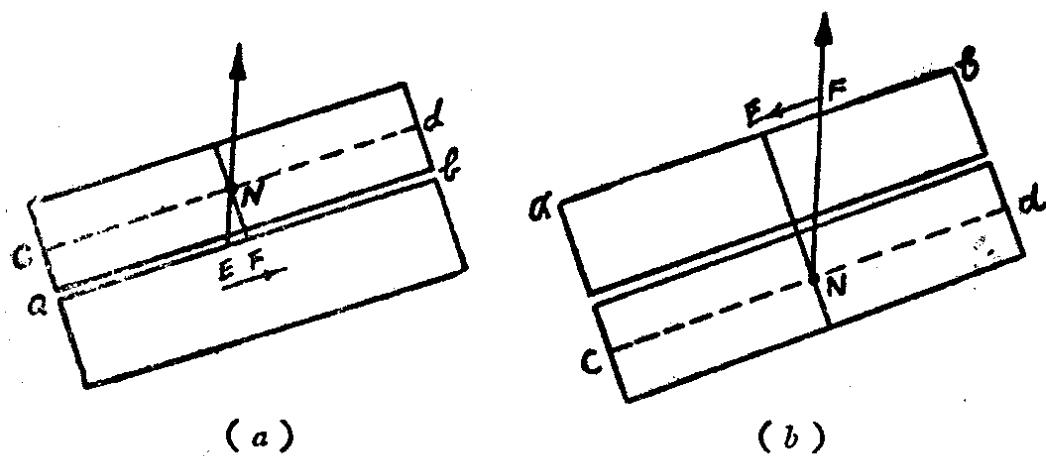


圖 7